



Scan statistics : methods and applications / edited by Joseph Glaz, Vladimir Pozdnyakov, Sylvan Wallenstein.

Glaz, Joseph
Pozdnyakov, Vladimir
Wallenstein, Sylvan

Springer,
2009.

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTMzMzNDA3NzI>

Título: Scan statistics : methods and applications / edited by Joseph Glaz, Vladimir Pozdnyakov, Sylvan Wallenstein.

Editorial: New York Springer 2009.

Descripción física: 391 p. 25 cm

Mención de serie: Statistics for Industry and Technology

ISBN: 978-0-8176-4748-3 Print) 978-0-8176-4749-0 Online)

Materia: Estadística de orden Muestreo (Estadística) 1D.3.

Autores: Glaz, Joseph Pozdnyakov, Vladimir Wallenstein, Sylvan

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es